Search Notes



Application/Control No.
10/780,939
Examiner
James D. Ewart

Applicant(s)/Patent under
Reexamination
LEE, CHANG-KYU
Art Unit

2683

SEARCHED									
Class	Subclass	Date	Examiner						
455	9	3/10/2006	JDE						
	13.3								
	26.1								
	63.4								
-	67.11								
	68								
	82								
	115.1								
	115.4								
	121								
	123								
	129								
	193.1								
	226.1								

INTERFERENCE SEARCHED										
Class	Subclass	Date	Examiner							
	<u>. </u>									

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)							
	DATE	EXMR					
		•					
		-					
,							

Search Notes (continued)

	_	^	_	•	_	1	•		•	•	_	-		1	_		ı	_			•		-	•	•	_	_	~	•
1	ı	П	ı	ı	Ħ	I۱	п	П	11	П	п	П	н	П	11	ı	Ti	ı	1	П	П	ı	11	ı	I	11		11	
ı	Ш	Ш	Ш	П	н	H	Ш	Н	II.	П	ш	П	H	Ш	Ш	ı	ı	Ш	H	ľ	u	ı	H	ı	Ш	Ш		Ш	
ı	Ш	Ш	Ш	П	H	Ił	Ш	Н	И	П	ш	Н	П	Ш	Ш	ı	ı	Ш	ı	H	H	ı	Ħ	ı	Ш	Ш	Ш	Ш	
ı	Ш	Ш	Ш	П	Ш	H	Ш	Ш	Ш	П	ш	Ш	П	Ш	Ш	ı	ı	Ш	П	П	Н	ı	Ш	ı	Ш	Ш	Ш	Ш	
ı	Ш	Ш	Ш	ı	Ш	H	П	Ш	Ш	H	ш	Ш	Н	Ш	H	ı	II	Ш	Ш	П	Ш	ľ	Ш	ı	Ш	Ш	Ш	Ш	
ı	Ш	Ш	Ш	ı	Ш	H	Ш	Ш	Ш	П	ш	Ш	П	Ш	Ш	ı	II	Ш	П	П	Ш	J	Ш	ı	Ш	Ш	Ш	Ш	
1	П	П	П	ı	Ш	П	H	ı	Ш	H	П	П	H	П	H	1	ı	П	H	ı	ı	1	П	ı	Ш	Ш	Ш	Ш	

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/780,939	LEE, CHANG-KYU	
Examiner	Art Unit	
James D. Ewart	2683	

	SEARCHED									
Class	Subclass	Date	Examiner							
455	423	3/10/2006	JDE							
	562.1									
	550.1									
	575.7									
343	703									
	711									
	751									
	893									
	894									
	876									
342	173									
	423									
	444		-							

INTERFERENCE SEARCHED										
Class	Subclass	Date	Examiner							
			-							
	I									

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)							
	DATE	EXMR					